嘉庚创新实验室公共支撑平台

**JEM-ARM300F2双球差校正透射电子显微镜**机时申请表

|  |
| --- |
| 以下由实验申请人填写： 申请日期： 年 月 日 |
| 申请人： 负责人（或导师）： 所在单位：  联系方式：（请写明系别、专业、房间号）：  电话： E-mail：  样品名称： 样品个数： 样品其它信息：  **注意事项：**  \* 用户应遵守本实验室的规章制度；实验完成后装样容器及时取回，未及时取回者下次申请延期安排；  \* 球差电镜拍摄的样品提前和管理员沟通确认，并通过普通透射电镜初步筛选；  \* 粉末样品粒径小于1um，厚度小于50nm，可分散在3mm载网上（纳米颗粒使用超薄碳膜载网，一维或二维纳米材料使用微栅载网，如有条件，建议使用坐标载网）；  \* 块体或薄膜样品根据实际需求选用电解双喷、离子减薄、聚焦离子束（FIB)、超薄切片等方法制备，厚度小于50nm，样品直径3mm；  \* 仪器内部为超高真空，本机所有样品必须经过充分干燥，不含结晶水；  \* 不接受低熔点或易分解的样品；  \* 磁性样品，如含有Fe, Co, Ni, Mn等磁性物质，与管理员具体联系；  \* 不接受放射性、腐蚀性、有毒、易挥发、易升华（单质硫、碘等）、易燃易爆、不符合生物安全标准、电子束辐照后不稳定等类似样品；  \* 易损伤等其他难测试样品，原位测试和管理员提前沟通确定；  \* 单次测试机时最小3小时起  **实验目的及预期结果：(请详细填写样品信息以更好完成测试)**   |  |  | | --- | --- | | **样品编号与代号** | **样品编号：1、2、3**  **样品代号：** | | **样品类型及制样信息** | **纳米颗粒** □ **薄膜 □ 器件 □ 磁性 □ FIB □ 喷金 □ 颗粒分散 □**  **截面样品 □ 平面样品 □ 包埋 □ 芯片器件 □ 其他 □** | | **样品成分/尺寸/厚度** |  | | **普通测试** | **TEM高分辨像 □ STEM高分辨像 □ EDS元素分析 □ EELS电子结构 □** | | **特殊测试** | **低电压测试 □ SAAF-OBF □** | | **4D-STEM □ 三维重构 □** | | **原位实验 □ 低温实验 □** | | **样品结构示意图（如有，包括多层膜或表面分布等）** |  | | **其他表征结果（如有）** |  |   **其他说明（实验目的或预期效果）：**  **声 明：**   1. 因隐瞒样品属性导致设备污染、损坏而引起的经济损失，由我科研项目经费赔偿； 2. 因误操作导致仪器损坏，所需维修费将从我科研项目经费中赔偿。   **我已了解仪器使用相关注意事项，提供的样品信息真实可靠，并按规范准备样品**  送样人签字： 年 月 日  **我已经认真阅读并同意以上注意事项和各项声明**。  负责人、导师签字： 年 月 日 |

**其他说明：**

1. **采取网站预约、送样预约，根据预约先后顺序，安排测试**
2. **目前仅开放高分辨拍摄和EDS能谱功能（其他功能将根据安装调试情况陆续开放）**
3. **不是所有样品都能获得理想的数据结果，建议先在普通透射电镜上筛选检查样品，再与管理员探讨可行性**
4. **样品尽量不要吸附或含有机物，建议有条件的进行离子清洗将有机物等污染处理干净**
5. **严禁磁性粉末样品直接进电镜，对于隐瞒或欺骗样品属性导致设备污染、损坏的，拉入黑名单，禁止预约测试**
6. **提前和管理员沟通确认测试需求，对于测试数据有异议的，请在拿到数据后两周內提出，逾期未提出者，默认测试数据满足需求。**
7. **测试完的样品和铜网由用户直接回收带走，实验室不保留，严禁将样品或铜网等物品遗留在实验室内，违反者取消预约权限**